



ライフタイム・鉄濃度・JPV・VQ/比抵抗測定装置

WTシリーズ

WT2000/2200/2500/3000

セミラボの誇るWTシリーズはm-PCD法によるライフタイム測定を始め、各種プローブ及びユニットの追加により拡散長測定 (SPV法)、鉄濃度測定、ジャンクションリーク、シート抵抗、ケルビンプローブによる酸化膜評価等の測定が1台でできます。

WT-3000



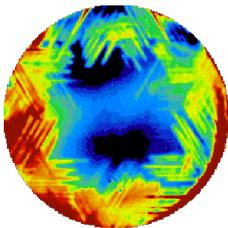
特徴

- さまざまな測定が1台で可能
- すべて非接触・非破壊で測定が可能
- ウェハだけでなく、セル・シリコンインゴット、ブロックの測定が可能 (WT2000シリーズのみ)
- 世界で豊富な実績

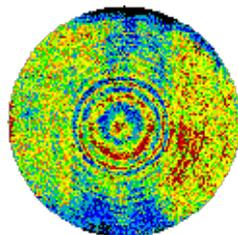
主な測定・評価項目

- m-PCD / キャリア・ライフタイム
- Laser SPV / 拡散長
- 鉄汚染による濃度測定
- セルの電流値測定 (LBIC)
- 反射率測定 / IQE (発電効率)
- Eddy (比抵抗測定)
- JPV (シート抵抗・ジャンクションリーク測定)
- VQ酸化膜評価 (ケルビンプローブ)

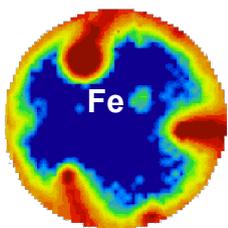
測定データイメージ



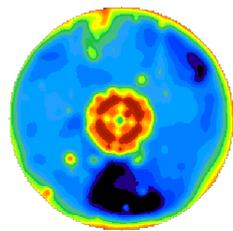
Slip lines



Oxygen striations

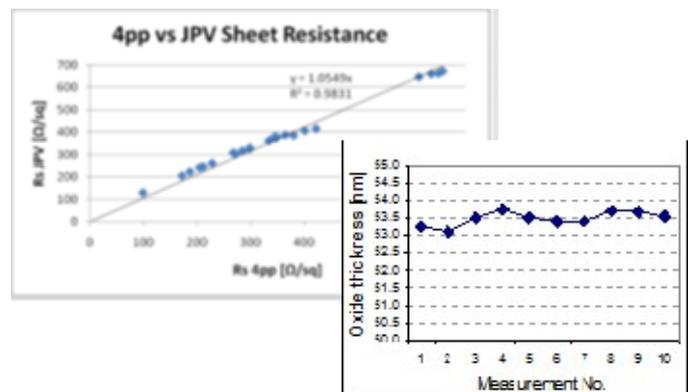


Fe detection



Contaminated vacuum chuck

SPV+鉄濃度



SEMILAB

日本セミラボ株式会社

横浜市港北区新横浜2-15-10 YS新横浜6F
Tel: 045-620-7960 Fax: 045-476-2146 www.semilab-jjp